

Especificaciones del Microscopio Electrónico de Barrido (SEM) Zeiss Merlin

Fabricante: Carl Zeiss Microscopy GmbH (Jena, Germany)

Año compra: 2010

Modelo: Merlin

Resolución:

- 0.8 nm a 15kV
- 1.4 nm a 1kV

Corriente de sonda: 4 pA–100 nA

Voltaje de aceleración: 0.2-30 kV

Detectores:

- Secundarios estándar (SE)
- Secundarios de alta resolución (*In-lens* SE)
- Retrodispersados con filtro de energía (*In-lens* EsB)
- Retrodispersados con selector de ángulo (AsB)
- Detector EDS Oxford LINCA X-Max
- EBSD análisis Oxford Nordlys II